

AXA シリーズ 耐寒・耐熱・高温高湿試験レポート目次

- データの利用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
- 耐寒性 AXA2R73061-M・・・・・・・・・・・・・・・・・・3~4
- 耐熱性試験 AXA2R73061-M・・・・・・・・・・・・・・・・・・5~7
- 高温高湿試験 AXA2R73061-M・・・・・・・・・・・・・・・・・・8~10

※一部の評価データを代表例として公開しています。

 サイト上に掲載のないデータについては、個別にお問い合わせをお願いいたします。

※特定商品の個別評価データについては、商品検索ページに掲載がございます。

本資料の記載情報またはそれに関するデータの利用上の注意

本資料に記載されている商品情報、またはそれに関するデータにつきましては、以下の内容を事前にご確認いただいたうえでご利用願います。本資料をご利用した時点で、以下内容に同意されたものとさせていただきますので、ご利用の前に必ずお読みください。

■本資料はお客様の性能を保証するものではなく、初期確認用の参考情報です。商品の改良等のために予告なく仕様や掲載情報を変更する場合があります、商品の仕様については正式に取り交わした仕様書に基づくものとします。採用のご検討やご注文の際は、当社販売窓口までお問い合わせのうえ、納入仕様書の取り直しをお願いいたします。

■当社は品質・信頼性の向上に努めておりますが、万が一に備え、十分な安全設計をお願いします。設計に際しては最大定格、動作電源電圧、動作温度など保証範囲内でお使いください。保証値を超えての使用など、本資料に記載のある商品の誤った使用または不適切な使用などに起因する商品の運用結果につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

■本資料に記載されている商品は、一般電子機器（情報機器、通信機器、音響映像機器、計測機器等）に使用されることを意図しています。特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある装置やシステム（交通機器、安全装置、航空・宇宙用、原子力制御、生命維持装置を含む医療機器など）にご使用をお考えのお客様は当社販売窓口までご相談ください。なお、相談なく使用されたことにより発生した損害等については、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

■本資料に記載されている技術情報は、商品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際しての当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または許諾を行うものではありません。

■本資料に記載されている商品の正規販売チャネル以外でのご購入または模倣品を使用したことに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

■本資料に記載されている商品のうち、外国為替及び外国貿易管理法に定める規制対象貨物・役務の輸出に際しては、同法に基づく輸出許可・承認が必要です。

■本資料は、予告なしに変更されることがあります。データに対する内容変更の連絡は行いません。また、本データ内容の変更、削除および改変によって生じたいかなる障害損失について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Uncontrolled

耐寒性	TEST REPORT
-----	-------------

製品名	SDメモリーカード用ソケット
データ No.	AXA2R73061-M-758
ページ No.	1 / 2

目的

耐寒性を確認する

試料

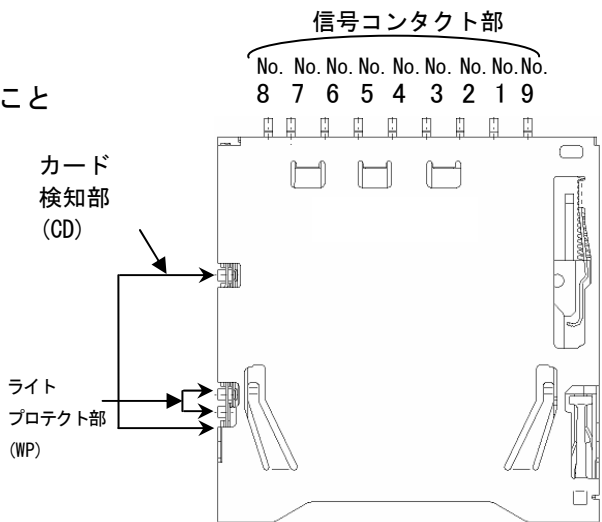
SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Rタイプ 標準
スタンドオフ 0mm 【AXA2R73061-M】 (N=3)

試験条件

温度: -55°C
試験状態: ソケットをプリント基板に実装し、SDカードをかん合する
使用カード: Panasonic 製評価用SDカード(以下、SDカード)
b), c) 項目の隣接コンタクト間の測定時は、SDカード未かん合、
シェルコンタクト間の測定時は、SDカードをかん合する
d) ~ f) 項目の測定は、SDカードをかん合して試験を行う

判定基準

- 1000時間放置後
- a) 外観: 変形、ソリ、クラックの発生無きこと
 - b) 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (D. C. 500Vにて)
 - c) 耐電圧: A. C. 500V (r. m. s.) ・ 1分間
(検知電流 1.0mAにて)
 - d) 接触抵抗
信号コンタクト部: 変化量 40mΩ以下
カード検知部: 150mΩ以下
ライトプロテクト検知部: 150mΩ以下
 - e) カードロック力: 40N以下
 - f) カードロック解除力: 1N以上 40N以下



試験結果

- a) 外観: 変形、ソリ、クラックの発生は見られない
- b) 絶縁抵抗

測定箇所	結果
隣接コンタクト間	全て 100MΩ以上
シェルコンタクト間	

- c) 耐電圧

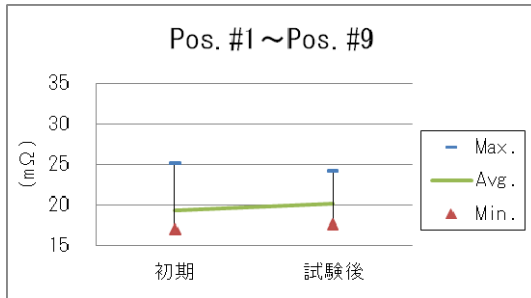
測定箇所	結果
隣接コンタクト間	短絡、絶縁破壊の問題無し
シェルコンタクト間	

本多通信工業株式会社	日付 2014.08.29	承認 古澤	検印 —	検印 大嶋	作成 佐藤
------------	------------------	----------	---------	----------	----------

耐寒性	TEST REPORT
------------	--------------------

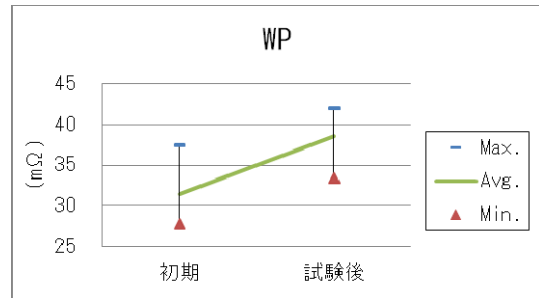
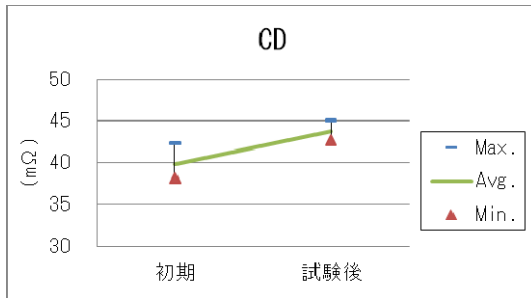
製品名	SDメモリーカード用ソケット
データ No.	AXA2R73061-M-758
ページ No.	2 / 2

d) 接触抵抗



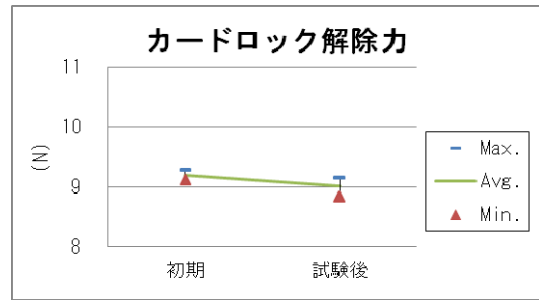
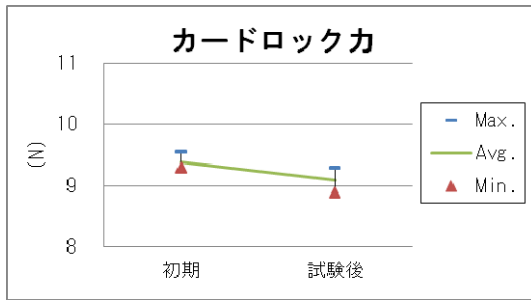
・ 変化量

	Pos. #1 ~ Pos. #9 1000 時間後
	Max.
Avg.	0.90
Min.	-0.86



e) カードロック力

f) カードロック解除力



- ・ カードロック力: カード挿入時にカムロックに必要な荷重
- ・ カードロック解除力: カード抜去時にカムロック解除に必要な荷重

判定

性能を満足する

Uncontrolled

耐熱性試験

TEST REPORT

品名 SDメモリーカード用ソケット

データ No. AXA2R73061-M-768

ページ No. 1 / 3

目的 耐熱性能の確認。

試料 SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Rタイプ 標準
スタンドオフ 0mm 【AXA2R73061-M】 (n=6)
基板: PWB-719-AXA t=1.4mm 金めっき

試験条件 温度 : 90°C
試験時間: 1000時間

判定基準

- ・絶縁抵抗 : 100MΩ 以上
- ・耐電圧 : AC500V 1分間 (検知電流 1mA にて)
- ・接触抵抗 : 信号コンタクト部 100mΩ 以下
検知コンタクト部 150mΩ 以下
- ・カードロック力 : 40N以下
- ・カードロック解除力 : 1N以上 40N以下
- ・外観 : 変形・ソリ・クラックの発生なきこと

試験結果

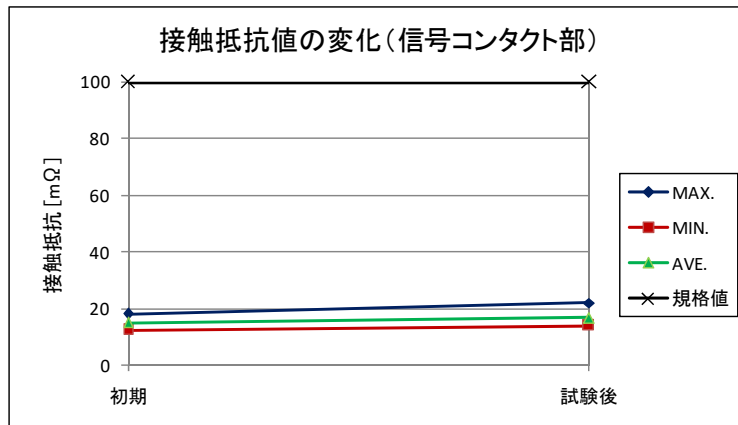
- ・絶縁抵抗

測定箇所	結果
隣接端子間	全端子間 100MΩ 以上
シェル-各端子間	

- ・耐電圧

測定箇所	結果
隣接端子間	AC500V 1分間にて短絡、損傷の問題なし
シェル-各端子間	

- ・接触抵抗



本多通信工業株式会社

日付
2019. 9. 4

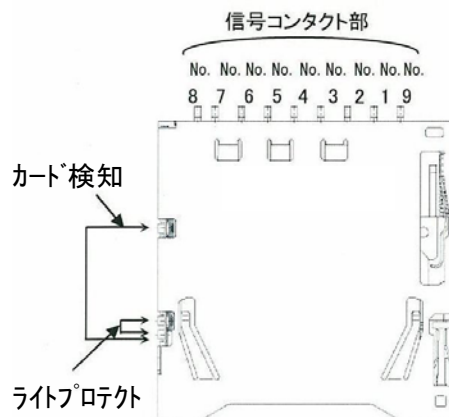
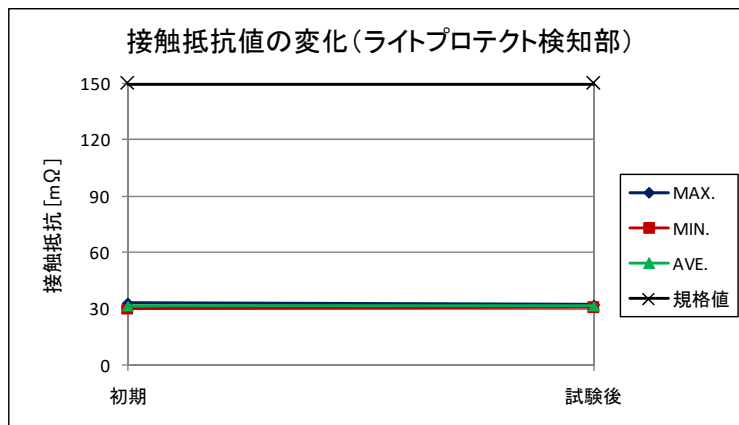
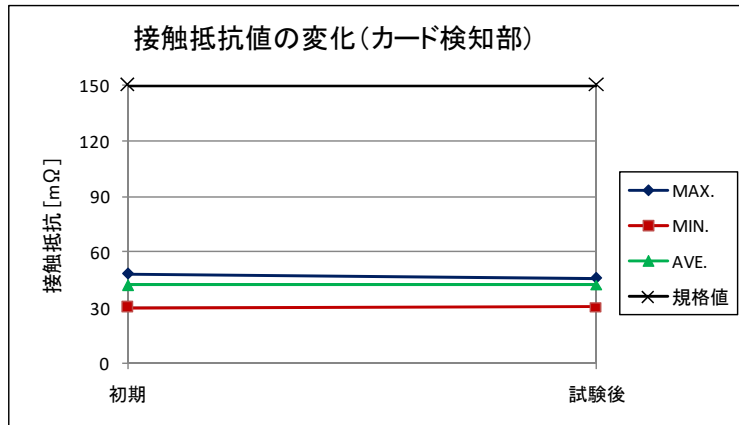
承認
加藤

検印
—

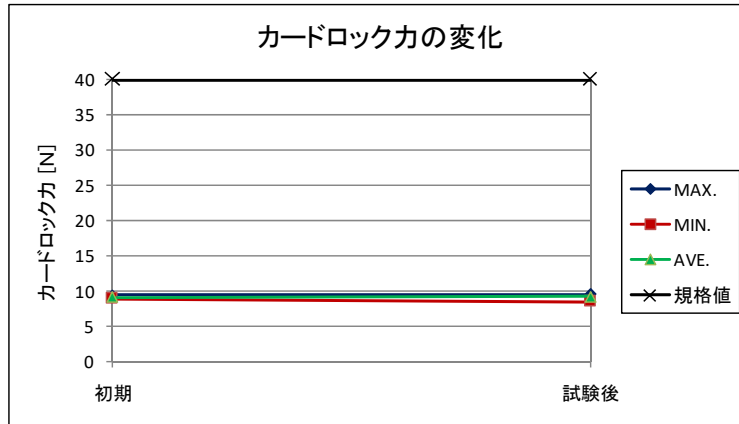
検印
吉田

作成
佐藤毅

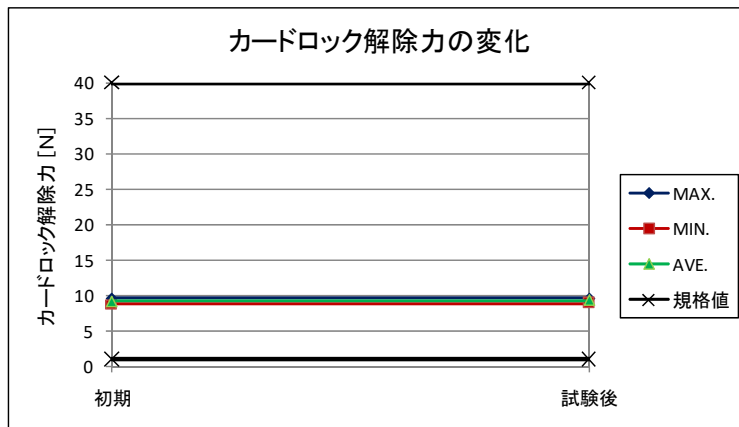
・ 接触抵抗



・カードロック力



・カードロック解除力



- ・カードロック力 : カード挿入時にカムロックに必要な荷重
- ・カードロック解除力 : カード抜去時にカムロック解除に必要な荷重

・外観 : 変形・ソリ・クラックの発生は見られない。

結論 性能を満足する。

Uncontrolled

高温高湿試験

TEST REPORT

品名 SDメモリーカード用ソケット

データ No. AXA2R73061-M-769

ページ No. 1 / 3

目的 耐高温高湿性能の確認。

試験料 SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Rタイプ 標準
スタンドオフ 0mm 【AXA2R73061-M】 (n=6)
基板: PWB-719-AXA t=1.4mm 金めっき

試験条件 温度 : 60°C
湿度 : 95%
試験時間 : 1000時間

判定基準

- ・絶縁抵抗 : 100MΩ 以上
- ・耐電圧 : AC500V 1分間 (検知電流 1mA にて)
- ・接触抵抗 : 信号コンタクト部 100mΩ 以下
検知コンタクト部 150mΩ 以下
- ・カードロック力 : 40N以下
- ・カードロック解除力 : 1N以上 40N以下
- ・外観 : 変形・ソリ・クラックの発生なきこと

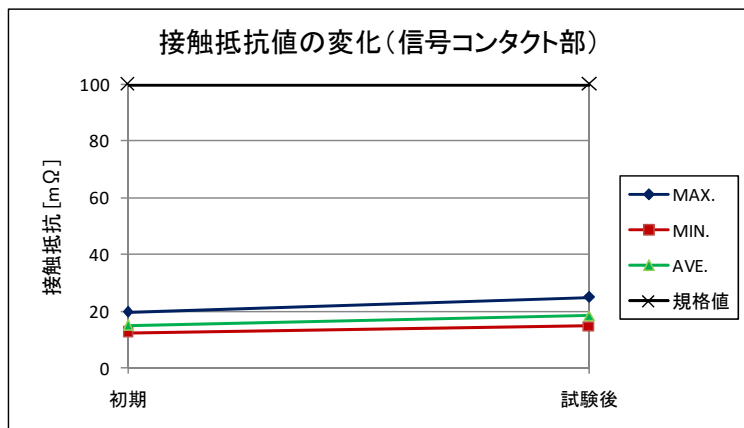
試験結果

測定箇所	結果
隣接端子間	全端子間 100MΩ 以上
シエルー各端子間	

・耐電圧

測定箇所	結果
隣接端子間	AC500V 1分間にて短絡、損傷の問題なし
シエルー各端子間	

・接触抵抗



本多通信工業株式会社

日付
2019. 9. 6

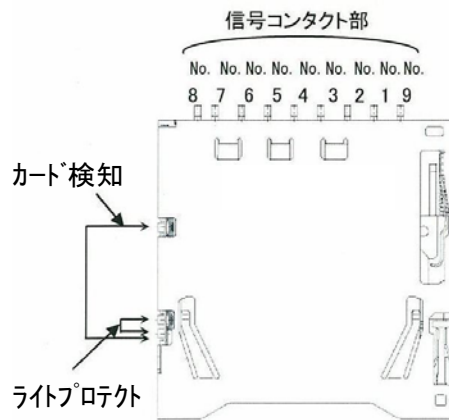
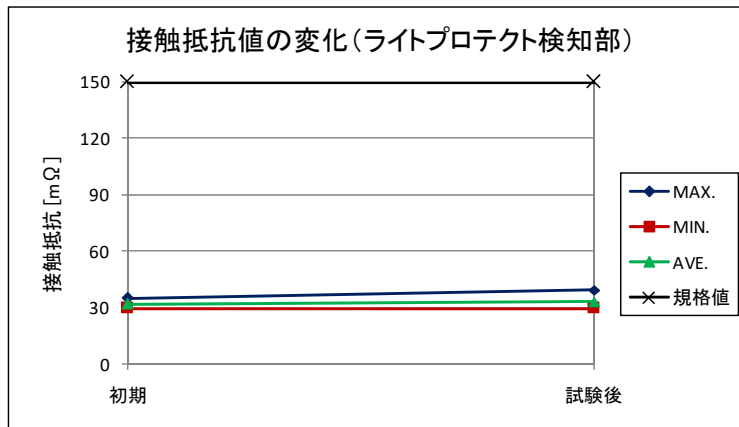
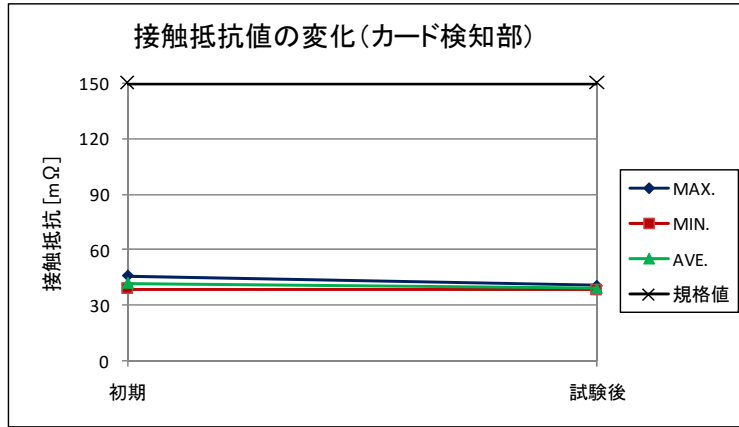
承認
加藤

検印
—

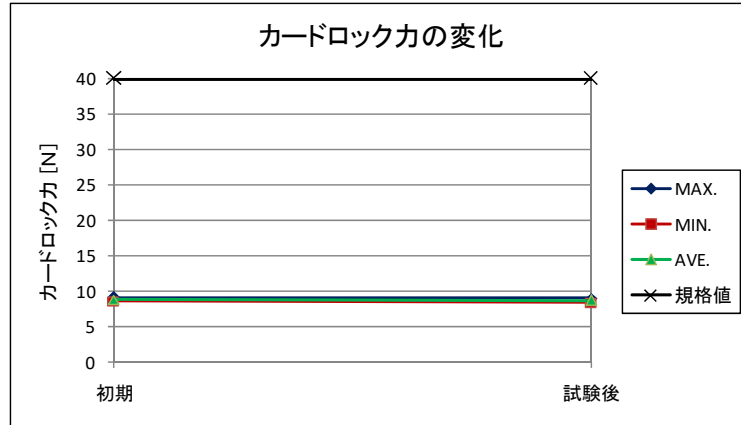
検印
吉田

作成
佐藤毅

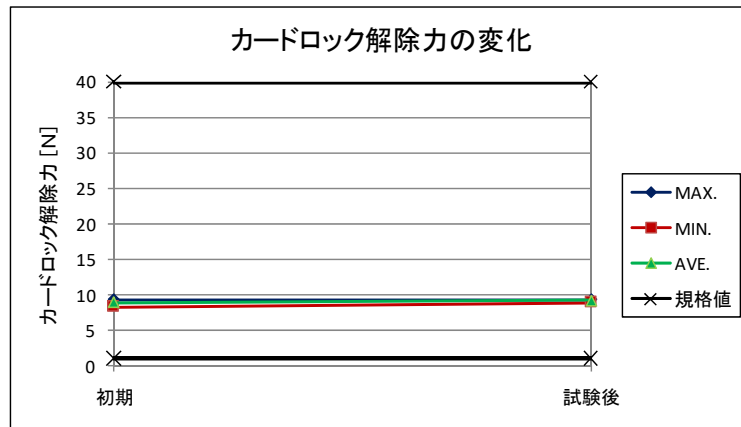
・ 接触抵抗



・カードロック力



・カードロック解除力



・カードロック力 : カード挿入時にカムロックに必要な荷重

・カードロック解除力 : カード抜去時にカムロック解除に必要な荷重

・外観 : 変形・ソリ・クラックの発生は見られない。

結論

性能を満足する。